



สารประกอบอินเดียมแกลตเดียมอาร์เซไนด์ (Indium Gallium Arsenide, In<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As) เป็นสารประกอบกึ่งตัวนำชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในปัจจุบันนอกจากนำไปใช้กับศูนย์ซิลิโคน (Silicon) ซึ่งถูกพัฒนาให้สามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมจนประสบความสำเร็จไปแล้ว วัสดุอินเดียมแกลตเดียมอาร์เซไนด์เริ่มเป็นที่สนใจเป็นครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 เมื่อจากเป็นสารกึ่งตัวนำที่มีสมบัติที่ดีทั้งทางไฟฟ้าและทางแสง ทำให้มีการศึกษาวัสดุอินเดียมแกลตเดียมอาร์เซไนด์เป็นครั้งแรกในรูปของสิ่งประดิษฐ์ไฟฟ้า-แสง (Optoelectronic Devices) สิ่งประดิษฐ์ในระยะเวลานี้ได้แก่ ไดโอดเปล่งแสงที่เปล่งแสงความยาวคลื่น 1.06 μm สร้างโดยวิธีการปูรุกผลิกด้วยสถานะไอ (Vapor-Phase Epitaxy) โดยการใช้การไถระดับค่าอัตราส่วนอะตอมจากแผ่นฐานแกลตเดียมอาร์เซไนด์เพื่อขึ้นจนถึงค่าที่ต้องการ [1] ต่อมาในช่วงกลางทศวรรษเดียวกันนี้ได้มีการใช้วิธีการปูรุกผลิกด้วยสถานะของเหลว (Liquid-Phase Epitaxy) สร้างวัสดุแกลตเดียมอินเดียมอาร์เซไนด์ฟอสไฟฟ์ (Ga<sub>x</sub>In<sub>1-x</sub>As,P<sub>y</sub>) บนแผ่นฐานอินเดียมฟอสไฟฟ์ (InP) ซึ่งผลให้มีการปรับปุ่งประสิทธิภาพในการส่งผ่านสัญญาณผ่านเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เพื่อลดการสูญเสีย ในปลายทศวรรษนี้ได้มีการสร้างวัสดุอินเดียมแกลตเดียมอาร์เซไนด์บนแผ่นฐานอินเดียมฟอสไฟฟ์ และนำไปใช้ในการสร้างไดโอดรับแสง (Photodiode) นอกจากนี้ได้มีการสร้างเกลเซอร์ ไดโอด โดยใช้วัสดุแกลตเดียมอินเดียมอาร์เซไนด์ฟอสไฟฟ์บนแผ่นฐานอินเดียมฟอสไฟฟ์ สร้างเป็นโครงสร้างรอยต่อต่างชนิดแบบทวิ (Double Heterostructure) ด้วย

งานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุอินเดียมแกลตเดียมอาร์เซไนด์ในระยะต้นส่วนใหญ่จะสร้างอยู่บนแผ่นฐานอินเดียมฟอสไฟฟ์ และสร้างได้เฉพาะที่มีค่าอัตราส่วนอะตอมเฉพาะค่าหนึ่งเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงภาระการไม่เข้ากันของผลึก (Lattice Mismatch) เมื่อวิธีการปูรุกผลิกได้รับการพัฒนาขึ้น ก็ได้มีการนำเอาวิธีการใหม่ๆ เข้ามาใช้กับวัสดุอินเดียมแกลตเดียมอาร์เซไนด์บ้าง วิธีการปูรุกผลิกที่เป็นที่สนใจในครุนภกิจจัยได้แก่ วิธีการปูรุกผลิกด้วยไออินทรีย์ของโลหะ (Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy, MOVPE) และวิธีการปูรุกผลิกด้วยคำไม้เล็ก (Molecular Beam Epitaxy, MBE) วิธีการปูรุกผลิกทั้งสองให้ผลึกที่มีคุณภาพสูง อย่างไรก็ตาม วิธีการปูรุกเหล่านี้จำต้องปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ ไปเมื่อถูกนำไปประยุกต์ใช้กับวัสดุอื่น อันเป็นหัวข้องานวิจัยที่ศึกษากันในช่วงเวลาถัดมา ช่วงต้นทศวรรษ 1980 เริ่มมีการสร้างวัสดุด้วยโครงสร้างพิเศษ ได้แก่ โครงสร้างผลึกขวางซึ่งมีความเกร็ง (Strained-layer Superlattice) ช่วงกลางทศวรรษเดียวกันได้มีการสร้างเกลเซอร์โดยใช้เทคนิคที่มีโครงสร้างควบคุมด้วยเวลาเป็นชั้นเปล่งแสง โดยมีกระแสขิดเริ่มเป็นปีก (Threshold Current) สำหรับวิธีการปูรุกผลิกทั้งสองนั้นเอง ในปัจจุบันจึงได้มีการศึกษาและสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยวัสดุ

อินเดียมแอกเติมอาร์เซนิคในรูปแบบต่างๆ มากน้อย เช่น ไอโอดิรันແສง ตัวตรวจจับແສงชนิด  
ໂຄະ-ສາງกຶ່ງຕົວນໍາ-ໂຄະ ເຕເຊອງໄດ້ໃຫຍ້ນິດຂ່ອງປັດແສງແນວຕັ້ງ (Vertical Cavity Surface  
Emitting Laser, VCSEL) ໂຄງຮ້າງກຳທອນທະຖຸຜ່ານ (Resonant Tunelling Structure) ໂຄງຮ້າງ  
ກວອນຕົມໄວ່ (Quantum Wire) ແລະ ກວອນຕົມເຄື່ອນ (Quantum Dot) ເປັນຕົ້ນ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาเรื่องไขที่สำคัญทางประการที่มีผลต่อคุณภาพของผลกอในเดือนกันยายนของอาร์เซไนด์ในโครงสร้างความต้านทานที่สร้างโดยวิธีการปั่นถูกผลักด้วยคำไม้เล็กๆ อันได้แก่ เรื่องไขของอุณหภูมิแผ่นฐานขณะทำการปั่นถูก ความกว้างของชั้นเวลส์ การควบคุมอัตราส่วนจำนวนอะตอมอนเดียมและเกลเดียม และการควบคุมความดันคำไม้เล็กของอาร์เซนิก การตรวจสอบจะทำโดยการวัดด้วยวิธีไฟไตรุ่มนีโนเซนซ์ (Photoluminescence) เป็นหลัก สำหรับในวิทยานิพนธ์นี้ บทที่ 2 จะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานของวัสดุอินเดียมอาร์เซไนด์ แก้ไขเดียมอาร์เซไนด์ และอินเดียมแกลเดียมอาร์เซไนด์ การปั่นถูกผลักด้วยคำไม้เล็กๆ กดกระตุกควบคุมดัน แกะหดถุงผ้าเกี่ยวกับการวัดด้วยวิธีไฟไตรุ่มนีโนเซนซ์ บทที่ 3 เป็นรายละเอียดของการออกแบบการทดลอง บทที่ 4 เป็นการทดลองที่ได้แก่การวิเคราะห์ผลการทดลอง บทที่ 5 เป็นสรุปของวิทยานิพนธ์นี้และบทสรุปท้ายเป็นขอเสนอแนะ